

## 37 - 17 大型フラットパネルディスプレイ膜厚検査装置の開発

衝撃・極限環境研究センター 教授 久保田 弘  
電気システム工学科 助教授 中田 明良  
大学院自然科学研究科 後期課程 羽山 隆史  
電気システム工学科 4 年 山口 貴弘  
他

フラットパネルディスプレイは高精細・省スペースなどの利便性から、パソコン、携帯電話、家電などの非常に多くの製品に利用されている。特に近年では大型TVの分野で、その需要が増加している。需要の増加に伴いFPDの品質に対する要求はCRT同様の性能が求められるようになってきている。FPDは構造上表示媒体であるガラス基板に半導体を層状につみ上げながら製造する必要があり、大型化したパネルの全面にわたる均一性をそれぞれの層で保つことは完成されたパネルの性能を左右する重要な要素である。そのためパネル全面にわたる均一性計測をパネル製造プロセスの中で逐次実施可能な高速かつ高精細な品質検査方法の導入が求められてきた。本報告では、連続視野角画像を利用した大型パネル対応の検査装置の測定原理と取得されたパネルの連続視野角画像を利用した膜厚検査について報告を行う。

(第18回熊本県産学官技術交流会講演論文集 2004.1)